

SEMICON Japan2015 出展品目

株式会社 サーマプレジジョン

2015年 12月 16~ 18日
東京ビッグサイト
東5ホール
小間番号
5403

全自動めっき液管理システム

Quali-Fill

- ・TSV, WLPプロセス向けカルママネジメントシステム
- ・Cu, Ni, Au, SnAg, Pd電解めっき液、無電解めっき液分析
- ・TSV, パンプ、再配線、アンダーパンプ、銅ピラープロセス分析モジュールの複数組み合わせ可能
- ・Quali-Doseドージングシステムによる薬液補給 (オプション)



超高速投影露光装置 応用露光装置 ASSシリーズ



- ・光学パラメーターの切り替えにより、多彩な露光ニーズに対応
- ・高深度露光の実現 (最適NAによるDOFの確保)
- ・モジュール構成によるお客様特別仕様への対応が可能
- ・多彩なレンズから最適な仕様選択が可能
TSV Bump, RD, LED (PSS)、
パワー半導体、ICサブストレートなど

Si(シリコン)濃度測定装置

QSF-50X

熱リン酸溶液中のシリカ濃度を測定できます
現在この測定が可能なのは市場でQSF-50Xシリーズのみです
自動分析、連続分析、自動キャリブレーション機能



アライナー (コンタクト・プロキ) 投影露光装置



UV-LED光源

カスタマイズ光学設計によりあらゆる露光機に対応
現行光源からリプレイス可能
高照度 (高生産性) ローコスト 省力化

めっき液分析装置

CVS QL-100EZ

実機あります



全ての硫酸銅めっき液添加剤に対応できます
電解めっき液 (Cu, Ni, Sn, Sn/Pb, Pd, Zn, Co/Ni)
有機添加剤、無機成分の分析
無電解めっき液 (Co, Cu, Ni, Pd)成分分析

全自動めっき液管理システム

Quali-Line

- ・ダマシプロセス向け分析装置 QLC-7500 / QLC-7500E
- ・有機添加剤、無機分析 (Cu, Cl, Acid)で高い分析精度と再現性を実現
- ・QLCシリーズの最新モデル: ランニングコスト低減、最新ソフトウェア
- ・分析法: CVS Express(New) 電気化学測定、吸光度測定など
- ・ネットワーク接続対応: 分析結果の送信、他装置との通信可能



酸化膜測定装置

SERA QC-100/QC-200



- ・QC-100
酸化膜測定 (Cu, Sn, Ag等) 酸化膜同定、膜厚測定
- ・QC-200
Cu, Agワイヤの検査管理、ボンディングワイヤ表面検査推奨品